\~15~

PAT-NO:

JP410098122A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 10098122 A

TITLE:

SEMICONDUCTOR DEVICE

PUBN-DATE:

April 14, 1998

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

YAMAMOTO, KAZUSHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

MATSUSHITA ELECTRON CORP

N/A

APPL-NO:

JP08251102

APPL-DATE:

September 24, 1996

INT-CL (IPC): H01L023/04, H01L023/02, H01L027/14

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To reduce size, without obstructing the airthightness by providing cover positioning protrusions facing diagonal corner cuts of a cover at specified positions of cover-mounting corners of a package having lead terminals, recessed semiconductor element mounts and cover mount.

SOLUTION: Lead terminals 1 are buried in a package 2, having a recess at the center for mounting a semiconductor element 3 and window frame 2b at the opening surface. Protrusions 2c are disposed at the diagonal corners of the frame 2b and face diagonal corner cut faces 7a of a cover 7 to avoid positioning deviation of the cover 7. Thus the protrusions 2c may be made comparatively large at positions which have no effect on the airtighness of the window frame 2b corners. This eliminates the need for providing positioning parts at the outside of the frame 2b and hence reduces the size with keeping the airtighness.

COPYRIGHT: (C) 1998, JPO

(19)日本国特許庁(J P)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平10-98122

(43)公開日 平成10年(1998) 4月14日

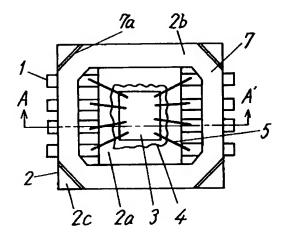
(51) Int.Cl.*		識別記号	ΡI				
HO1L 2	23/04		H01L 23/04 23/02 27/14		G . D		
2	23/02					F	
	27/14				D		
			審査請求	未請求	請求項の数3	OL (全 4 頁)	
(21)出願番号	21)出顧番号 特顯平8-251102		(71)出顧人	000005843 松下電子工業株式会社			
(22)出顧日		平成8年(1996) 9月24日		大阪府高槻市幸町1番1号			
(ce/ mex n		1 1000 5 712111	(72)発明者	(72)発明者 山本 一志			
		,	(1-7)	大阪府高槻市幸町1番1号 松下電子工業株式会社内			
			(74)代理人		施本 智之	(外1名)	

(54) 【発明の名称】 半導体装置

(57)【要約】 (修正有)

【課題】 半導体素子が搭載される中空パッケージを蓋 材で封着する際に、蓋材をウインドフレームの所定位置 に、精度良く位置決め封着しかつ気密性を阻害せずにパ ッケージ体を小型化する。

【解決手段】 凹形状をした半導体素子3の搭載部と蓋材7の搭載部とがあるパッケージ体2において、蓋材の搭載部コーナの所定位置に、蓋材の対角コーナカット面と相対峙し、蓋材7を位置決めする突起部2Cを配置した。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 複数のリード端子と、凹形状をした半導 体素子搭載部と、蓋材の搭載部とを有した半導体装置に おいて、前記蓋材の搭載部コーナに、蓋材の対角コーナ カット面と対峙し該蓋材を位置決めする突起部を配置し たことを特徴とする半導体装置。

【請求項2】 突起部は、少なくともシール有効領域外 にあり蓋材の対角コーナカット面と相対峙する構成から なる請求項1記載の半導体装置。

【請求項3】 突起部は、突起部高さが少なくとも、蓋 10 材厚みより以上であることから構成された請求項1記載 の半導体装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、固体撮像素子装置 (CCD) などのように、蓋材で容器形状型の中空パッ ケージを封着して、パッケージ室に半導体素子を気密封 着する小型の半導体装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来のこの種の半導体装置は、図5、図 20 6に示すように、複数のリード端子1を配した電気絶縁 性材料による容器状のパッケージ体2からなり、該パッ ケージ体2の開口底のダイアタッチ部2aで、ワイヤー 5を配線された半導体素子3が固着され、その開口上面 に蓋材7を固着するウインドフレーム部2bが構成され ている。

【0003】なかでも、蓋材7搭載時に生じる該蓋材7 の位置ずれを防止するため、ウインドフレーム部2b面 上の周囲に突起部2cが設けられ該蓋材7の側縁部に当 接し位置決めをするようになっていた(例えば特開平2 30 ための半導体装置の断面図である。 -66961号)。

【0004】また一方では図7、図8に示すように、ウ インドフレーム部2bの周囲に開口段部2dが設けら れ、前記同様の効果をするようになっていた(例えば特 開平2-66961号)。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら上記のよ うな構成では、ウインドフレーム部の周囲に開口段部あ るいは突起を設けて、蓋材の側縁部を位置決めするた め、ウインドフレーム幅が所定の蓋材幅と位置決め部 (開口段部あるいは突起)幅で決定され、結果としてパ ッケージ体幅が大となり、小型化が困難であるという問 題点を有していた。

【0006】また、突起形成の方法では、気密性確保の ため所定の蓋材幅を維持したなかで、ウインドフレーム 部に突起を設けるため、突起幅が微小で強度が低下し欠 けなどの問題があった。

【0007】本発明はかかる従来の問題点を解消するも ので、半導体素子が搭載される容器形状型の中空パッケ ージを蓋材で封着する際に、蓋材をウインドフレームの 50 シリコーン樹脂などの熱硬化性樹脂や紫外線硬化性樹脂

所定位置に、精度良く位置決め封着しかつ気密性を阻害 せずに該パッケージ体を小型化することを目的とする。 さらに、他の方法によれば、蓋材の表面を摩擦などによ る外圧から保護することを目的とする。

[0008]

【課題を解決するための手段】上記問題点を解決するた めに、本発明の半導体装置は、複数のリード端子と、凹 形状をした半導体素子の搭載部と蓋材の搭載部とがある パッケージ体で前記蓋材の搭載部コーナの所定位置に、 蓋材の対角コーナカット面と相対峙し、該蓋材を位置決 めする突起部を配置したという構成を備えたものであ る.

【0009】本発明は上記の構成によって、蓋材に設け た該蓋材の対角コーナカット面に相対峙し、ウインドフ レーム部コーナの突起部で位置決めするため、従来のよ うに蓋材の外形側縁部を支持する位置決め部(開口段 部、突起部)スペースが不要となる。結果として、所定 のパッケージ体幅、蓋材幅を変える事なく比較的大きな 突起部が設けられるようになるのである。

【0010】また他方、突起部面積が大にできるため、 高さ方向の加工が容易となり、蓋材厚み以上の突起高さ を形成することができ、これにより蓋材表面への摩擦に よる外圧から保護するようになるのである。

[0011]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施形態を添付図 面にもとづき説明をする。

【0012】図1は本発明の一実施形態による半導体装 置の平面図、図2は同半導体装置の断面図、図3は同半 導体装置の部分平面図、図4は本発明の他の効果を示す

【0013】図1、図2、図3に示す本発明の一実施形 態による半導体装置では、複数個の所定形状をしたリー ド端子1が、パッケージ体2に埋め込み配線されてい る。パッケージ体2は、例えばエポキシ樹脂、ポリイミ ド樹脂、フェノール樹脂の成型体或いは、アルミナなど のセラミック成型体から形成され、その表面中央部が凹 形状になり半導体素子3を内部に搭載するようにされて いる。

【0014】半導体素子3は、前記凹形状底部のダイア 40 タッチ部2a面に、ペースト接着剤、ガラス接着剤或い は共晶合金などの接着層4を介して固着され、該半導体 素子3の端子は、金アルミなどのワイヤー5細線によっ て、リード端子1の所定位置に電気的接続がされてい る.

【0015】このように、半導体素子3を搭載し電気的 接続がされたパッケージ体2は、凹部開口表面にあるウ インドフレーム部2bで、封着層6を介して蓋材7を用 い加圧封着され凹内部を気密封止するようになってい る。前記封着層6は、エボキシ樹脂、ボリイミド樹脂、

が用いられ、他方では低融点ガラスやソフトソルダー或 いは、シームウエルダーによる電気溶接などが用いられ る。 蓋材7は、ガラス、プラスチック、アルミナ、サフ ァイヤなどの透明板材あるいは、前記材質を始め金属な どの不透明板材が用いられる。

【0016】特に本発明の一実施形態では、パッケージ 体2の開口表面にあるウインドフレーム部2bの対角コ ーナ位置に突起部2cが、蓋材7の対角コーナカット面 7aと相対峙し、該蓋材7を位置決めしズレ防止をする ように設けてある。さらに詳しくは、図3に示すように 10 突起部2cは、該蓋材7のコーナ側シール幅W3を、所 定のシール幅W1、W2と等しい距離を確保する位置に 形成され、該蓋材7のコーナも同位置までカットされて いる。

【0017】上記構成において、突起部2cはウインド フレーム部2 b コーナの気密性に影響のない位置に比較 的大きく設けることができる。そのため、ウインドフレ ーム部26の外周に位置決め部 (開口段部あるいは突 起)を設けるスペースが不要となり、結果として所定の 気密性を維持しながら小型化ができる効果がある。

【0018】前記突起部2cの形状は三角柱を例に述べ たが、その他形状であってもウインドフレーム部2bコ ーナの前述所定位置にあれば、同様の効果があることは 明白である。

【0019】次に本発明の他の実施形態を図4を用いて 説明する。図4において前記実施形態と相違する点は、 突起部2cの高さを蓋材7の厚みより以上となる構成と したことにあり、この構成によれば半導体装置の製造お よび取り扱いの際、該蓋材7表面と作業台や治具、設 備、収容ケースなどの構造体8面とが接触時、突起部2 30 2b ウインドフレーム部 c先端で受け止め、該蓋材7表面を保護するため、結果 として機械的摩擦によるキズや欠け、あるいは汚れ、異 物付着などの不具合(特にCCDなどのように、蓋材を 透過した光信号を利用する半導体装置では、前記不具合 は大きな問題である)を防止するという効果がある。

[0020]

【発明の効果】以上のように本発明の半導体装置によれ ば、次の効果が得られる。

【0021】(1)パッケージ体表面のウインドフレー

ム部コーナで突起部が蓋材の対角コーナカット面と相対 峙し、蓋材を位置決めする構成としているので、ウイン ドフレーム部の外周に位置決め部(開口段部あるいは突 起部)を設けるスペースが不要となり、結果として所定 の気密性を維持しながら小型化ができるという効果があ る.

【0022】また、突起部をコーナ全域を利用としてい るので、比較的大きな形状とすることができ、強度や成 型加工性に優れるという効果もある。

【0023】(2)突起部の高さを蓋材の厚みより以上 となる構成としているので、該蓋材の表面と作業台や治 具、設備、収容ケースなどの構造体面とが接触時、突起 部先端で受け止め、該蓋材表面をキズや欠け、汚れ、異 物付着などの不具合から防止するという効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施形態における半導体装置の 区面平辖要

【図2】同半導体装置の要部断面図

【図3】同半導体装置の一部を拡大した要部平面図

【図4】本発明の他の効果を示すための半導体装置の要 20 区面油窑

【図5】従来の半導体装置の要部平面図

【図6】従来の半導体装置の要部断面図

【図7】従来の他の半導体装置の要部平面図

【図8】従来の他の半導体装置の要部断面図 【符号の説明】

1 リード端子

2 パッケージ体

2a ダイアタッチ部

2 c 突起部

2d 開口段部

3 半導体素子

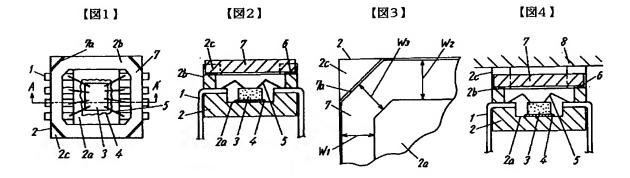
4 接着層

5 ワイヤー

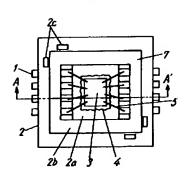
6 封着層

7 蓋材

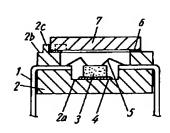
8 構造体



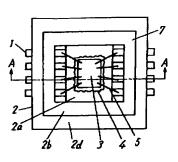
【図5】



【図6】



【図7】



【図8】

